

Система генерирования тестов для микропроцессоров

Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; Zaugarov, Viktor; Крупнова Е.; **Storožev, Sergei** Proceedings of international conference "Technical Diagnostics-93", St.-Peterburg, June 8-10, 1993 1993 / p. 87-89